



MODEL 58625

特點

- 多合一整合型測試機
- 可彈性安排多種測試站
- 具精準之溫度平台控制能力
- 溫控範圍可達 -20~85°C
- 光學模組可支援大角度之發光角量測
- 實現奈秒級高速測試 (選配)

應用範圍

- 3D 感測發光模組與晶片特性測試
- 車用 Lidar 發光模組與晶片特性測試
- 各種雷射 (Laser) 產品之特性測試

光電元件模組多功能測試系統 PHOTONICS MODULE TEST SYSTEM MODEL 58625

Chroma 58625 為 3D 感測發光模組之特性測試設備，可結合各種不同光學模組於同一自動化平台，精準控制溫度並完成所有測試。依不同光學模組之安排，其測試內容涵蓋電性、光能量、波長、近場光學、遠場光學等各種光電特性參數，非常適合 3D 感測發光元件之產品開發與產品品質出入料檢驗。

光能量與波長量測 (LIV+ λ)

搭配高性能積分球與高解析度光譜儀可應用於量測 3D 感測發光模組之光能量與波長特性，Chroma 58625 並提供彈性化設計，使用者可依不同之測試需求自訂測試情境，透過光能量 (Light Power)、電流 (Current)、電壓 (Voltage) 的掃描測試，可推算出各種光電參數如閾值電流 (Ith)、光電轉換效率 (PCE)、斜率效率 (SE)。

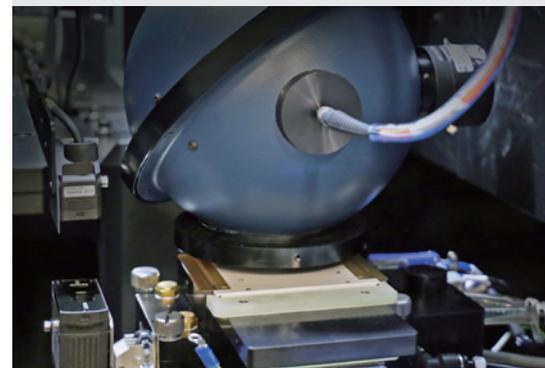
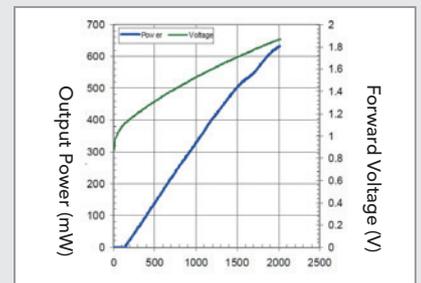
遠場光學量測 (Far Field Test)

於 3D 感測發光模組的遠場光學量測應用上，Chroma 58625 以屏幕投影式技術，可量測高達 120 度發散角之 3D 感測發光模組，利用 Chroma 開發之獨特演算法，分析遠場光型，獲得發散角、均勻性 (beam uniformity) 與 IEC 60825 人眼安全規範 Class 1 的自動判斷。另外，Chroma 58625 亦可搭配 beam profiler，提供更高解析度之測試需求。

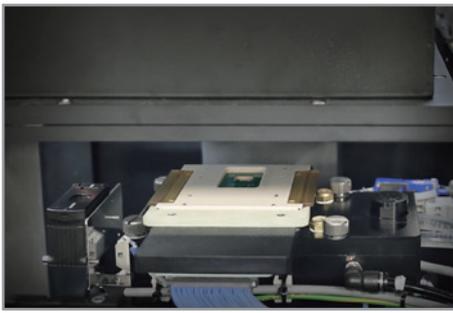
近場光學量測 (Near Field Test)

近場光學量測主要應用於 3D 感測模組中發光晶片 (Laser Diodes) 之近場光學量測，搭配高性能之顯微鏡模組與自動尋光平台，可量測雷射 (Laser Diodes) 之光腰寬 (Beam waist W0)、發散角 (divergence angle)、射束品質 (beam propagation ratio M2)；另外，應用於多光源雷射 (Laser array) 時，透過 Chroma 獨特的影像分析技術可獲得雷射光強度均勻性 (uniformity) 之資訊。

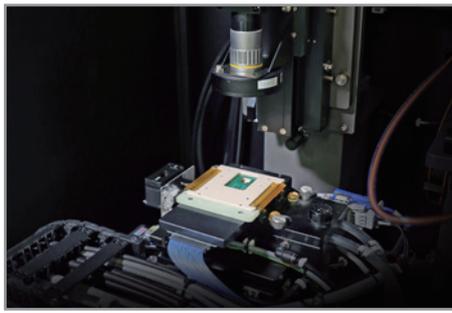
Light-Current-Voltage Characteristics



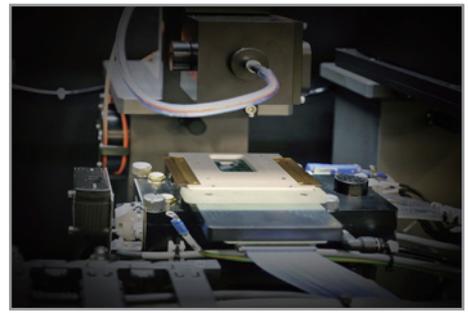
Chroma



遠場光學檢測模組



近場光學檢測模組



精確溫度控制平台

規格表

Model	58625
Max. Supported Test Stations	4
Temperature Control of Test Station	Standard: 25~85°C ; Option: -20~85°C
Temperature Accuracy	± 0.3°C ^{*1}
Temperature Stability	± 0.1°C ^{*2}
Clean Room Class	10,000
Current Accuracy	0.2% F.S.
SMU Specification	
Number of SMUs (25W max. each)	2 channels (additional channels optional)
Driving Mode	CW and Pulse
Pulse Mode	≤ 6A, ≤ 5V, 100us Pulse width, ≤ 10%
CW Mode	Max. ≤ 3.5A/5V
Current Range	± 6A/± 3.5A/± 2.5A/± 1A/± 100mA/± 10mA/± 1mA/± 100µA/± 10µA/± 1µA
Voltage Range	± 25V/± 12.5V/± 10V/± 5V/± 2V/± 1V/± 500mV/± 200mV/± 100mV
LIV+ λ Measurement	
Test Parameters	Optical power (w), Forward voltage (v), PCE(%), SE, λ p and λ c (nm)
Integrating Sphere Cover Angle	≤ 120° ^{*2}
Optical Power Measurement Range	1mW~10W ^{*2 *3}
Wavelength Range	800~1,000nm
Wavelength Optical Resolution	≥ 0.25nm
FFP Test (Projection)	
Test Parameters ^{*4}	FOI uniformity, divergence angle
Coverage Angle	≤ 120°
Optical Power Measurement Range	100mW~10W ^{*5}
NFP Test (Laser Diode)	
Test Parameters ^{*4}	Standard: Relativity, Intensity, Uniformity, Dead emitters Option: W0, M ² , Divergence angle
Optical Module ^{*6}	ND filters, NA ≤ 0.3@940nm (manual selection)
Effective FOV	1.6x1.2mm (emitter size ≤ 1.4x1mm)
Optical Power Measurement Range	10mW~10W (940nm)

Note *1 : Temperature accuracy and stability specs are based on the reading of the thermal couple inside the socket. The DUT will determine the thermal gradient between the thermal couple and junction temperature.

Note *2 : Correlation is required for accurate optical power measurement, especially for wide angle emission.

Note *3 : For optical power > 6.5W, correlation is required for an accurate measurement.

Note *4 : D86 and D4 sigma selectable

Note *5 : Camera exposure time is proportional to the optical power. ND filters may be required to compensate the optical power.

Note *6 : Cover chip angle ≤ 36°

訂購資訊

58625 : 光電元件模組多功能測試系統

下載 Chroma ATE APP，取得更多產品與全球經銷資訊



iOS



Android

Search Keyword

58625

總公司
致茂電子股份有限公司
333001桃園市龜山區
文茂路88號
T +886-3-327-9999
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

中國
中茂電子(深圳)有限公司
廣東省深圳市南山區
登良路南油天安工業村
4號廠房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

東莞服務部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609

重慶辦公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

致茂電子(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州高新區珠江路
855號獅山工業廊 7 號廠房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

廈門分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

中茂電子(上海)有限公司
上海市欽江路333號40號樓3樓
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964